ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทรศัพท์ : 02 - 470 - 8907 โทรสาร : 02 - 470 - 8900
E-mail : sic.fsci@mail.kmutt.ac.th Website : sic.kmutt.ac.th

อัพเดทข้อมูล
03/10/2022

กลุ่มทางฟิสิกส์
เครื่องมือวิเคราะห์

เครื่องมือ	X-ray Fluorescence (XRF)
ความสามารถ	สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้ตั้งแต่ธาตุ Na ถึง U
ยี่ห้อ	Fischer
รุ่น	XUV 773
รายละเอียด	- วิเคราะห์หาชนิดและปริมาณโลหะโดยใช้หลักการวัดแบบเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์ (X-ray for analysis material by ED-XRF method) - สามารถวัดความหนาของชิ้นงานได้
ตัวอย่าง	- ของเหลว ตัวอย่างต้องมีปริมาตรอย่างน้อย 2 ml - ของแข็งเป็นชิ้น ตัวอย่างขนาดไม่เกิน 135 x 135 x 100 mm - ของแข็งเป็นผง ตัวอย่างต้องมีปริมาณอย่างน้อย 1 g - แผ่นฟิล์ม ตัวอย่างขนาดไม่เกิน 135 x 135 x 100 mm
การเตรียมตัวอย่าง	ต้องเตรียมตัวอย่างมาเอง
เวลาดำเนินการ	7-14 วันทำการ
ข้อจำกัด	สามารถวัดธาตุ Na เลขอะตอม 11 ขึ้นไป ***ต่ำกว่านี้วัดไม่ได้***
รายงานผลที่จะได้รับ	1. เปอร์เซ็นต์ของธาตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนชิ้นงานตัวอย่าง และ ความหนาของชิ้นงาน 2. เปอร์เซ็นต์ของธาตุ ***ในรูปสารประกอบออกไซด์***
เงื่อนไขที่ต้องระบุเพื่อทำการวิเคราะห์	ถ้ามีชิ้นงานก่อนการเคลือบมาด้วยจะทำให้ผลการวัดมีความแม่นยำมากขึ้น

ค่าบริการ (บาท)

รายการ	มจธ.	หน่วยงานราชการ	หน่วยงานเอกชน
ค่าวิเคราะห์ตัวอย่าง			
- ชิ้นงานตัวอย่าง	600 / ตัวอย่าง	800 / ตัวอย่าง	1,000 / ตัวอย่าง
- ผงตัวอย่าง/ของเหลว	800 / ตัวอย่าง	1,000 / ตัวอย่าง	1,200 / ตัวอย่าง
- ความหนาของชิ้นงาน	800 / ตัวอย่าง	900 / ตัวอย่าง	1,000 / ตัวอย่าง

หมายเหตุ: 1. กรณีต้องการผลเปอร์เซ็นต์ของธาตุ ***ในรูปสารประกอบออกไซด์*** มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในอัตรา 300 บาท/ตัวอย่าง (ได้ผลรูปแบบ Raw data เท่านั้น)
2. การวัดแต่ละครั้งจะวัดชิ้นงานละ 5 ตำแหน่ง ถ้ามากกว่านั้นจะคิดเป็นชิ้นงานชิ้นใหม่

X-ray Fluorescence (XRF)
Fischer / XUV 773